

# DIN 50990:2018-12 (D)

## Messung von Schichtdicken - Messung der flächenbezogenen Masse von metallischen Schichten mittels spektrometrischer Messverfahren

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	4
1 Anwendungsbereich.....	5
2 Normative Verweisungen .....	5
3 Einheiten .....	5
4 Kurzbeschreibung.....	5
5 Geräte und Reagenzien.....	6
5.1 Geräte.....	6
5.2 Reagenzien .....	6
6 Einflüsse auf das Messergebnis .....	7
6.1 Oberfläche.....	7
6.2 Messstelle.....	7
6.3 Fremdanteile in der Schicht.....	8
6.4 Chemisches Auflösen.....	8
6.5 Anodisches Auflösen .....	8
6.6 Grundwerkstoff.....	8
6.7 Störungen der Messungen .....	8
7 Durchführung .....	9
7.1 Probenvorbereitung.....	9
7.2 Herstellen der Lösungen.....	9
7.2.1 Allgemeines.....	9
7.2.2 Probenlösungen.....	9
7.2.3 Blindwertlösung .....	9
7.2.4 Bezugslösungen .....	9
7.3 Bezugsfunktion .....	10
7.4 Durchführung der Messungen.....	11
8 Auswertung .....	12
9 Messunsicherheit .....	13
10 Prüfbericht .....	14
Anhang A (informativ) Beispiele für Ablöseflüssigkeiten .....	15
Literaturhinweise .....	17
<b>Tabellen</b>	
Tabelle 1 — Geeignete Wellenlängen zur AAS — Analyse metallhaltiger Lösungen .....	10
Tabelle 2 — Geeignete Wellenlängen zur ICP — Analyse metallhaltiger Lösungen [4] .....	11
Tabelle 3 — Dichte des Volumenmaterials.....	13
Tabelle A.1 — Beispiele für Ablöseflüssigkeiten.....	15